

Invenția se referă la domeniul tehnicii de măsurare și poate fi utilizată în aparate de măsurat, în care se utilizează senzori pe bază de oxizi semiconductori nanostructurați.

Dispozitivul de măsurare a parametrilor senzorilor pe bază de oxizi semiconductori micro- și nanostructurați include o sursă de tensiune de referință ( $U_{ref}$ ), tensiunea căreia se aplică la intrarea unuia din convertorii analogic-digitali (ADC) ai unui microcontroler (MCU) printr-un amplificator operațional, și care este conectată în serie cu o nanostructură cercetată ( $R_x$ ) și un rezistor suplimentar ( $R_0$ ), iar căderea de tensiune de pe rezistorul suplimentar ( $R_0$ ) se aplică la intrarea unui al doilea convertor analogic-digital (ADC) al microcontrolerului (MCU) prin cel de-al doilea amplificator operațional. Ieșirea microcontrolerului (MCU) este conectată la un ecran pentru afișarea rezultatelor obținute.

Revendicări: 1

Figuri: 2

